

{joomplu:1466}В период с 05 по 07 апреля сотрудники НИЯУ МИФИ и АО «ЭНПО СПЭЛС» Никифоров А.Ю., Боруздина А.Б., Московская Ю.М., Кессаринский Л.Н., Уланова А.В., Усачев Н.А. приняли участие с устными докладами в ежегодной Международной научно-технической конференции «Пути решения задач обеспечения современной радиоэлектронной аппаратуры надежной электронной компонентной базой» («Сертификация ЭКБ - 2017»), которая проходила в г. Санкт-Петербург, Россия ([ссылка на сайт с информацией о конференции](#)).

Конференция устраивается ежегодно АО «РНИИ «Электронстандарт» в конгресс-зале отеля «Park Inn (Пулковская)». В этом году в работе конференции приняли участие более 400 специалистов из более чем 50 организаций России и Республики Беларусь, среди которых (Министерство промышленности и торговли РФ, АО «Российская электроника», ФГУП «МНИИРИП», ГК «Ростехнологии», ГК «Роскосмос», ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, АО «РНИИ «Электронстандарт» и многие другие).

Основная работа конференции проходила в течение двух дней на пленарном (18 докладов) и секционном заседаниях (44 доклада), в т.ч. стендовой секции (6 докладов). Перечень докладов приведен в [Программе конференции](#).

{joomplu:1465} **Основными тематическими вопросами, обсуждаемыми на конференции, являлись:**

-вопросы и проблемы обеспечения импортозамещения ЭКБ ИП в радиоэлектронной аппаратуре;

-новые разработки ЭКБ ОП;

-современные вопросы стандартизации и сертификации в области ЭКБ;

-вопросы выбора и применения ЭКБ ОП и ИП для высоконадежной аппаратуры;

-надежность и радиационная стойкость современной ЭКБ и особенности их оценки для высоконадежной аппаратуры;

-порядок применения ЭКБ ИП в радиоэлектронной аппаратуре;

-порядок подтверждения соответствия ЭКБ ИП условиям применения;

-методы выявления контрафактной ЭКБ ИП.

Перечень докладов сотрудников НИЯУ МИФИ и АО «ЭНПО СПЭЛС»:

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ:

1.

Название доклада: **Состояние и развитие системы оценки и контроля радиационной стойкости ЭКБ.**

Авторы: А.Ю. Никифоров, В.А. Телец, О.А.Калашников, Д.В.Бойченко, А.В.Уланова, Л.Н.Кессаринский, Г.В.Чуков

Организация: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Докладчик: д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич

2.

Название доклада: **Тенденции и проблемные вопросы создания радиационно-стойкой электронной компонентной базы твердотельной СВЧ электроники**

Авторы: ¹В.В. Елесин, ²Г.Н. Назарова, ¹А.Ю. Никифоров, ¹Д.И. Сотсков, ¹В.А. Телец, ¹Н. А. Усачёв,

²
Г.В. Чуков,

³
И.Н. Кабанов,

³
А.Н. Щепанов

Организации: ¹Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», ²АО «ЭНПО СПЭЛС»,
³

ФГУП «МНИИРИП»

Докладчик: к.т.н. Усачёв Николай Александрович

ДОКЛАДЫ В СЕКЦИЯХ:

3. ([ссылка для скачивания](#))

Название доклада: **Новые возможности исследований и прогнозного контроля радиационной стойкости ЭКБ в процессе разработки и производства**

Авторы: Ю.М. Московская, А.Ю. Никифоров, Д.В. Бобровский, Д.В. Бойченко

Организация: АО «ЭНПО СПЭЛС»

Докладчик: Московская Юлия Марковна

4. ([ссылка для скачивания](#))

Название доклада: **Радиационная стойкость различных классов оптических изделий: доминирующие эффекты, методики испытаний и основные результаты**

Авторы: А.В.Уланова, М.Е.Черняк, А.А.Печенкин, А.Г.Петров, А.Ю.Никифоров,

А.И.Чумаков

Организация: АО «ЭНПО СПЭЛС»

Докладчик: к.т.н. Уланова Анастасия Владиславовна

5. ([ссылка для скачивания](#))

Название доклада: **Катастрофические отказы ЭКБ от ТЗЧ: основные эффекты, особенности испытаний и оценки соответствия изделий требованиям ТЗ.**

Авторы: *А.В. Яненко, А.Б. Боруздина, А.И. Чумаков, А.А. Печенкин, Д.В. Бобровский.*

Организация: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Докладчик: к.т.н. Боруздина Анна Борисовна

6. ([ссылка для скачивания](#))

Название доклада: **Особенности поведения и оценки радиационной стойкости аналоговых полузаказных СБИС.**

Авторы: \square *¹Л.Н.Кессаринский, ¹А.Я. Борисов, ¹Д.В.Бойченко, ¹Ю.М.Московская, ²В.В.Энн
с*

Организации: ¹АО «ЭНПО СПЭЛС», ²ДЦ «Союз»

Докладчик: к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич